

# 氮化镓氮化硅涡流法方阻电阻率测试仪

产品名称	氮化镓氮化硅涡流法方阻电阻率测试仪
公司名称	九域半导体科技（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼205室（注册地址）
联系电话	13739170031

## 产品详情

参数	方阻	电阻率（厚度180um）	方法
探头量程	1-600 / " "	0.018-10.8 cm	涡流法
探头性能	动态重复性	静态重复性	示值误差
	1-80 / " ( 0.018 - 1.44 cm ) < 0.2%	<0.01%	± 1%
	80-120 / " ( 1.44 - 2.16 cm ) < 0.3%		
	120-300 / " ( 2.16 - 5.4 cm ) < 0.5%		
300-600 / " ( 5.4 - 10.8 cm ) < 1%			
外形尺寸	上探头 20*145mm	下探头 20*50mm	
信号采集	采样率：大1500Sps		
	采样个数：大512点/单次		
	采样缓存：8级数据记录缓存		
	数据传输：RS232 RS485CAN TCP/IP		
	传输协议：Modbus Rtu/ Modbus Tcp 用户自定义协议等		
供电电源	24V/1A		

非接触式无损方块电阻测试仪、晶圆方阻测试仪，方阻测试仪，硅片电阻率测试仪，涡流法高低电阻率分析仪，晶锭电阻率分析仪，涡流法电阻率探头和PN探头测试仪，迁移率（霍尔）测试仪，少子寿命测试仪，晶圆、硅片厚度测试仪，表面光电压仪JPV\SPV、汞CV、ECV。为碳化硅、硅片、氮化镓、衬底和外延厂商提供测试和解决方案。